

7. März 2017

9:00	Sitzungsleitung: Prof. Dr. M. Kreyenschmidt Begrüßung
9:10	<i>K. Slickers, Bad Harzburg</i> F-OES von Zinkmetall unter besonderer Berücksichtigung gelöster/ungelöster Elementanteile
9:35	<i>R. Nützel, Herzogenaurach</i> Spektroskopische Analysen zur Qualitätsüberwachung an Wälzlagerstählen
10:00	<i>D. Poerschke, Duisburg</i> Einzelfunkenanalyse – Theorie und betriebliche Praxis
10:25	<i>H.-G. Joosten, L. Neitzsch, Kleve</i> Werkstoffidentifikation basierend auf der Analyse – kein triviales Problem
10:50	Pause
11:20	<i>Burkart Adamczyk, Dominik Schiller, David Mory, Christian Adam, Berlin</i> Online Analytik an Hochtemperaturschmelzen mit der Laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIBS)
11:45	<i>C. Bohling, Berlin</i> LIBS goes industry – Schnelle und berührungslose inline Elementanalytik in industriellen Prozessen
12:10	<i>T. Lostak, J. Flock, E. Pappert, Duisburg</i> Einsatz der Online-Elektrolyse zur Probenvorbereitung metallischer Proben für die ICP-OES
12:35	<i>K. Ohls, Dortmund</i> Gedanken zur analytischen Methodik
13:00	Mittagspause
14:10	Sitzungsleitung: S. Hanning <i>W. Vautz, Dortmund</i> Wie riechen Feststoffe?
14:35	<i>A. von Bohlen, Dortmund</i> Coca Cola: Zucker und was noch? Erste Ergebnisse eines weltweiten Aufrufs
15:00	<i>M. Haschke, Eggersdorf</i> Der Wert unseres Geldes – nicht nur eine analytische Fragestellung
15:25	<i>M. Kolbe, R. Fliegau, B. Beckhoff, E. Beyer, E. Darlatt, I. Holfelder, P. Hönicke, Berlin</i> Oberflächenanalytik für's neue Kilogramm
15:50	Pause
16:20	Sitzungsleitung: Dr. E. Pappert <i>L. Bienkowski, München</i> Neueste Entwicklungen bei Silizium-Drift-Detektoren
16:45	<i>P. Fuchs, Kassel</i> Chemische Analyse und mehr – tiefere Materialeinsichten mit Hilfe der Benchtop XRD
17:10	<i>R. Yellepeddi, C. Fontugne, Ecublens</i> X-ray Diffraction using Real-Time Curved Detection and Applications for Materials and Structural Analysis
17:35	<i>V. Szwedowski, Berlin</i> Untersuchung von Nanoschichtsystemen mittels GEXRF im Labor
18:00	Ende der Veranstaltung

8. März 2017

9:00	Sitzungsleitung: Dr. J. Flock <i>J. Schram, J. Schlag, G. Renner, S. Barcikowski, Krefeld</i> Anwendung neuer minimalinvasiver Probenahmetechniken für Metalle in der Archäometrie
9:25	<i>V. Herrmann, Würzburg</i> Einsatzmöglichkeiten der μ -RFA beim Gummirecycling
9:50	<i>H. Richert, Düsseldorf</i> Herausfordernde Fragestellungen in der Mikro-XRF Analytik und ihre Lösungsmöglichkeiten.
10:15	<i>M. Krämer, Dresden</i> Tropfen und Schichten – (T)XRF-Quantifizierung im Labor
10:40	Pause
11:10	<i>P. Dzierzawa, Kleve</i> Physikalische Unterschiede zwischen gas- und elektrisch-betriebenen Schmelzaufschlüssen
11:35	<i>F. Davidts, Brüssel</i> Maintaining good fusions for continued reproducible and repeatable XRF analysis
12:00	<i>R. Schramm, Kleve</i> Erfahrungsbericht über den Einsatz platinfreier Tiegel im elektrischen Schmelzaufschluss
12:25	<i>M. Ehard, Beckum</i> Die automatische Schlackenprobenaufbereitung mit dem POLAB APMplus
12:50	Mittagspause
14:00	Sitzungsleitung: Dr. A. von Bohlen <i>M. Lindhuber, F. Portala, H. Lüers, M. Scherrer, Karlsruhe</i> Genau richtig, statt ungefähr falsch – Industrielle Prozesskontrolle mit EDRFA
14:25	<i>J. Wess, Kassel</i> Ölanalyse mit der Benchtop-XRF. Geht das online?
14:50	<i>J. Heckel, D. Wissmann, D. Sachtler, M. Beckhoff, Kleve</i> Analyse geringer Probenmengen von unbekanntem Proben mittels EDRFA
15:15	<i>T. Bach, Hirschau</i> Qualitative und quantitative Bestimmung von Schwermineralien in Rohstoffen
15:40	Pause
16:10	<i>P. Lemberge, D. Bonvien, Ecublens</i> Latest Developments in EDXRF for improved materials analysis
16:35	<i>E. Blokhina, F. Keller, S. Hanning, M. Kreyenschmidt, Berlin/Steinfurt</i> Thickness independent quantification of trace heavy elements in light matrix
17:00	<i>K. Behrens, J. Stelling, K. Termin, D. Lamers, Karlsruhe</i> Innovation ist eine Idee in Aktion – Neues von der WDRFA
17:25	<i>S. Hanning, F. Keller, S. Grothues, M. Kreyenschmidt, Steinfurt</i> Untersuchung von Gegenständen des täglichen Bedarfs – Verbraucherschutz mit der RFA
17:50	Ende der Veranstaltung